Technical Report

報文

高温カレンダー寿命試験におけるリチウムイオン 電池の正極の抵抗増加メカニズム -硬 X 線および軟 X 線吸収分光法を利用した 正極活物質の局所構造解析ー **Mechanism of Resistance Increment for Positive** Electrode of Li-Ion Battery through Calendar Life Test at High Temperature Local Structure Analysis of Positive Active Material by Hard and Soft X-ray Absorption Spectroscopy — 平** 池田祐一* 田尾洋 城 戸 良 太* 増 田 真 規*** 山 福 太 郎*** 澄 里*** 佐 々 木 丈*** 森 稻 益 德 雄* Yuichi Ikeda Yohei Tao Rvota Kido Masaki Masuda Taro Yamafuku Sumio Mori Takeshi Sasaki Tokuo Inamasu

Abstract

Local structure of $LiNi_{1-x}Me_xO_2$ (Me = Co, Mn) positive active material has been analyzed by hard and soft X-ray absorption spectroscopy in order to clarify the mechanism of resistance increment for positive electrode of a Liion battery through a calendar life test at high temperature. In our previous research, we had found that the increment is attributed to increment of charge transfer resistance. In this report, we have investigated whether increment of this resistance is caused by reduction of electrochemical activity in bulk or on surface of $LiNi_{1-x}Me_xO_2$. As a result, the Ni K-edge XANES spectra obtained using hard X-ray reveals that the reduction of the activity mainly occurs on the surface. Furthermore, the Ni L-edge and O K-edge XANES spectra obtained using soft-X-ray indicate the formation of cubic spinel phase on the surface. These results suggest that the reduction of the activity is caused by the formation of cubic spinel phase on the surface.

Key words: X-ray absorption spectroscopy, Hard X-ray, Soft X-ray, Local structure, Positive active material

*** 研究開発センター 第五開発部

^{*}研究開発センター 第二開発部

^{**(}株)ブルーエナジー 技術開発部

1 はじめに

ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車などの 移動体用途、太陽光発電や電力安定化システムなどの 産業用途をはじめとして、様々な分野で広く採用され つつあるリチウムイオン電池(以下,LIBと記す)には、 高いエネルギー密度だけでなく、高い入出力性能も求 められている. この入出力性能は, 充放電サイクル数 や放置期間に応じて徐々に低下する.入出力性能の低 下は直流抵抗の増加と相関があるため、直流抵抗の増 加メカニズムの解明は、さらなる高性能な LIB 開発を 進める上で極めて重要である. これまでに、高温カレ ンダー寿命試験に供試した LIB の直流抵抗の増加要因 を明らかにするため、対称モデルセルを使用して正極 および負極の直流抵抗の分離解析を実施した. その結 果,解析した LIB の直流抵抗増加の主要因は正極側に あり,その中でも正極活物質/電解液界面でのLi+脱 挿入にともなう反応抵抗(以下,正極の反応抵抗と記 す)の増加であることを報告した¹. 正極の反応抵抗 の増加を引き起こす劣化現象として、活物質粒子表面 でのLi 欠損や酸素脱離にともなう変質層 (LiNi_{0.8}Co_{0.2}O₂の場合,立方晶岩塩構造のNiO²)の形 成や活物質粒子の孤立化3(活物質粒子の導電ネット ワークからの欠落)などがある.ここで、活物質粒子 は、二次粒子を構成している一次粒子をあわらす.特 に、活物質粒子表面での立方晶岩塩構造の形成は、活 物質粒子の電気化学活性の低下(容量を発現する元素 の価数変化量の減少と定義する)も同時に引き起こす.

試験後の正極活物質の局所構造変化を調べる方法と して,X線吸収分光法が良く知られている4.本分光 法では、材料のバルクおよび表面に存在する元素の価 数や周囲の原子種,原子間距離,配位数などの局所構 造の情報を取得できる. さらに, 照射 X 線の種類に よって得られる元素情報や電子軌道情報も異なる. そ のため、硬X線および軟X線吸収分光法を利用する ことは、活物質粒子の電気化学活性の低下を評価する 上で極めて有効であると考えられる.本検討では、こ れらの分光法などを利用して正極の反応抵抗の増加を 引き起こす主たる劣化現象の解析をおこなった、その 結果、活物質粒子表面にこれまでに報告されている立 方晶岩塩構造だけでなく, 主に立方晶スピネル構造が 形成されていることを確認し、これが正極の反応抵抗 の増加を引き起こした主要因であることを示唆する結 果を得たので報告する.

2 実験方法

2.1 解析用電池の作製

正極板は、リチウム遷移金属酸化物 LiNi_{1-*}Me_{*}O₂ (Me = Co, Mn)の活物質粉末、炭素系導電助剤および 結着剤を混合したペーストをアルミニウム箔上に塗布 して乾燥させた後、プレス機で厚さを調整することで 作製した.負極板は、炭素の活物質粉末および結着剤 を混合したペーストを、銅箔上に塗布して乾燥させた 後、プレス機で厚さを調整して作製した.これらの正 極、負極およびポリオレフィン製微多孔性セパレータ ーを巻回した後、電池ケースに挿入した.ケース内に LiPF₆を含むカーボネート系有機電解液を注入して密 封し、解析用電池を作製した.

2.2 カレンダー寿命試験

初期容量確認試験を実施した後,定電流定電圧充電 により電池を所定の充電状態(State of charge, SOC) に調整し,高温下で所定の期間を放置するカレンダー 寿命試験を実施した.

2.3 正極の電気化学特性評価

2.3.1 正極板の取り出し

初期容量確認試験のみの電池,およびカレンダー寿 命試験後の電池を完全放電した後,それらをアルゴン 雰囲気(露点 ≦ -70℃)のグローブボックス内で解 体して正極板(以後,それぞれ初期品および試験品と 記す)を取り出した.そして,ジメチルカーボネート (DMC)で洗浄し,乾燥させた.

2.3.2 正極合材の再混練極板の作製

試験品から正極合材のみを剥離して合材粉末を得た.合材粉末に,新品の炭素系導電助剤と結着剤とを加え(合材粉末:炭素系導電助剤:結着剤 = 87:5:8 (重量比)),乳鉢内で15分程度混練をおこなった. 得られたペーストをアルミニウムメッシュ上に塗布し て乾燥・プレスさせて試験品の再混練極板(以下,再 混練品と記す)を作製した.

2.3.3 正極板の容量確認試験

初期品, 試験品, または再混練品を所定の電極面積 (初期品, 試験品: 1.5 cm², 再混練品: 4.5 cm²) に加 工したものを作用極, 金属 Li を対極および参照極, LiPF₆を含むカーボネート系有機電解液を電解液とし て三電極式ビーカーセルを作製した. 周囲温度 25[°] にて, まず定電流で 3.2 V vs. Li/Li⁺まで放電させた. そのあと, 上限充電電位を 4.3 V vs. Li/Li⁺として 0.1 CmA の電流で 30 分間充電した後に 30 分間の休止を 設けて正極の疑似開回路電位 (Quasi-open circuit potential, QOCP) を測定する作業を 50 回繰り返した. そして,下限放電電位を 3.2 V vs. Li/Li⁺ として 0.1 CmA の電流で 30 分間放電した後に 30 分間休止を設 けて正極の QOCP を測定する作業を 50 回繰り返した. 積算放電容量と正極の QOCP との関係から,放電レ ートに依存しないと考えられる放電容量を求めた.

2.4 正極板の硬 X 線および軟 X 線吸収分光測定

2.4.1 正極板のサンプル作製

初期品および試験品の電極面積が4 cm²になるように加工して各正極板 / 新品セパレーター / 金属 Li の順に重ね合わせ,解析用電池に使用した電解液と同組成のものを注入して密封し,小型の二電極式電池を作製した.そして,定電流定電圧充電により正極電位をそれぞれ 3.74, 3.81, 3.95 および 4.19 V vs. Li/Li⁺になるように調整した.そのあと,アルゴン雰囲気のグローブボックス内で二電極式電池を解体し,DMCで洗浄した後に乾燥させて,X線吸収分光測定用の正極板とした.

2.4.2 硬 X 線吸収分光測定

Ni-K 吸収端の硬 X 線吸収分光測定は, SPring-8 の BL14B2 にて実施した.活物質粒子のバルク情報を取 得できる透過法での測定は,各正極板をアルミラミネ ートで密封して常圧の大気非暴露下で実施した.活物 質粒子の表面(100 nm以下)情報を取得できる転換 電子収量(Conversion Electron Yield, CEY)法での測定 は,常圧でヘリウム雰囲気下の測定チャンバー内に各 正極板を設置して測定した.

2.4.3 軟 X 線吸収分光測定

Ni-L 吸収端および O-K 吸収端の軟 X 線吸収分光 測定は、立命館大学 SR センターの BL11 にて実施し た.軟 X 線を使用すると、遷移金属の価数変化に直 接関与する d 軌道の情報や、軽元素の酸素の情報を 取得できる.測定用の各正極板はトランスファーベッ セルを使用して大気非暴露下で測定チャンバーに導入 した.そして、部分電子収量 (Partial Electron Yield, PEY) 法により活物質粒子の表面(数 nm 以下)情報 を取得した.なお、この測定は高真空下(10⁻⁸ torr 程度)で実施した.

2.4.4 スペクトルデータの解析

硬 X 線吸収分光測定により得られた Ni-K 吸収端の スペクトルデータから, Athena⁵ を使用してプレエッ ジおよびポストエッジのバックグラウンド除去, エッ ジジャンプの規格化, ならびに EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) 領域のフーリエ変換 による動径分布関数計算をおこなった. 活物質粒子バ ルクおよび表面の Ni 価数の比較には、規格化後の XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) 領域 のスペクトルを使用した.また、活物質粒子バルクお よび表面の Ni-O および Ni-Me (Me = Ni, Co, Mn) 原 子間結合距離の計算には、動径分布関数をもとに Artemis⁵ を使用した.軟 X 線吸収分光測定により得 られた Ni-L 吸収端のスペクトルデータの解析は、 Ni-K 吸収端のスペクトルデータの解析と同様に Athena を使用した.

2.5 走査透過型電子顕微鏡による正極断面の観察

X線吸収分光測定により得られた結果を検証するた め、球面収差補正付走査透過型電子顕微鏡 (Corrector-Spherical Aberration Scanning Transmission Electron Microscope, Cs-STEM) により、初期品および試 験品の断面の高角度散乱環状暗視野 (High-Angle Annular Dark Field, HAADF) 観察とナノビーム回折を おこなった. Cs-STEM 分析には、正極電位 4.19 V vs. Li/Li⁺ に調整した各正極板を大気非暴露下で収束 イオンビーム (Focused Ion Beam, FIB) 装置に導入し、 -100℃の環境下で薄膜化したサンプルを使用した.

3 結果と考察

3.1 正極抵抗増加の原因解析

これまでの報告¹から,高温カレンダー寿命試験後 に解析用電池の直流抵抗(50%SOCの電池において 10秒間通電した時の直流抵抗)は14~15%増加する. そして,その主要因である正極の反応抵抗は20%増 加する.この原因となる主な劣化現象として,次に示 す(i),(ii)を抽出した;(i)活物質粒子の孤立化(活物質 粒子の導電ネットワークからの欠落),(ii)活物質粒子 表面での変質層の形成(活物質粒子の電気化学活性の 低下).(i)に関して,正極合材の再混練工程における 正極単極容量の回復の有無を検証することで,(ii)に 関して,試験前後での活物質粒子バルクおよび表面の Ni 価数変化量をX線吸収分光法により検証すること でそれぞれの劣化現象の解析をおこなった.

3.2 正極単極容量の推移

初期品, 試験品および再混練品において放電レート 不依存と考えられる放電曲線(Depth of discharge (DOD)-QOCP 曲線)を Fig. 1 に示す. 試験品の放電 容量は, 初期品のそれと比較して 7% 程度減少してい る. 一方, 再混練品の放電容量は, 試験品のそれとほ とんど同等である. このことから, 試験品の放電容量 の減少は活物質粒子の孤立化によるものでなく, 活物 質粒子の電気化学活性の低下によるものであると考え られる.この劣化現象が,正極の反応抵抗の増加に寄 与していると推察される.

3.3 硬 X 線吸収分光測定の結果

3.3.1 XANES スペクトル

各正極電位における活物質粒子バルクおよび表面の



Fig. 1 Depth of discharge (DOD)—Quasi-open circuit potential (QOCP) curves of $\text{LiNi}_{1-x}\text{MexO}_2$ positive electrodes collected from the cells after (\bigcirc) the initial capacity test, (\bullet) the calendar life test, and (\bullet) the calendar lif

Ni-K 吸収端 XANES スペクトルをそれぞれ Fig. 2 (a), (b) に示す.活物質粒子バルクおよび表面ともに,正 極電位が貴になるにつれてスペクトルが高エネルギー 側ヘシフトしている. このことは、どちらも正極電位 が貴になるにつれて Ni 価数が増加していることを示 す. そこで、Ni価数を評価するため、吸収係数が0.5 となるエネルギー値を求めた. 活物質粒子バルクおよ び表面におけるこのエネルギー値と正極電位との関係 をそれぞれ Fig. 3 (a), (b) に示す. 初期品および試験 品の正極電位 3.74 ~ 4.19 V vs. Li/Li⁺ における活物 質粒子バルクのエネルギー変化量をそれぞれ △ (Ebulk) ini および △ (Ebulk) test とすると, 前者は 1.86, 後者は 1.72 eV である.一方,初期品および試験品に おける活物質粒子表面のエネルギー変化量をそれぞれ Δ (E_{sur})_{ini} および Δ (E_{sur})_{test} とすると, 前者は 1.69, 後 者は 1.51 eV である. いずれも Δ (E_{sur})_{ini.} < Δ (E_{bulk})_{ini.} △ (Esur)ini である. このことから, 活物質粒子表面の電 気化学活性はバルクのそれより低いこと,および試験 品の活物質粒子表面の電気化学活性は初期品のそれよ りも低いことが考えられる. すなわち, 試験品の活物 質粒子表面に電気化学活性が低下した層(いわゆる変 質層)の形成が示唆される.

3.3.2 EXAFS スペクトル

活物質粒子表面の Ni-K 吸収端の EXAFS スペクト ルをフーリエ変換して得た動径分布関数を Fig. 4 に示 す. 1.5 Å 付近の第一近接ピークは Ni と O の相互作



Fig. 2 Ni K-edge XANES spectra of (a) bulk and (b) surface of $LiNi_{1-x}Me_xO_2$ positive electrodes at (\blacksquare , —) 3.74, (\blacktriangle , —) 3.81, (\bigcirc , —) 3.95 and (\diamondsuit , —) 4.19 V vs. Li/Li⁺ at initial and after calendar life test.



Fig. 3 Relationship between the energy at the half-step height of Ni K-edge XANES spectra of (\bigcirc) bulk and (\bigcirc) surface and potential of LiNi_{1-x}Me_xO₂ positive electrodes (a) at initial and (b) after test.

用に起因し, 2.5 Å 付近の第二近接ピークは Ni と Me (Me = Ni, Co, Mn)の相互作用に対応する. Ni 原子と 周辺にある原子(ここではOおよびMe)との結合距 離から Ni 価数の情報を得るため、動径分布関数にお ける第一近接および第二近接ピークをフィッティング して Ni-O 結合および Ni-Me 結合距離を計算した. なお, Ni-O 結合は一種類の Ni-O シェル, Ni-Me 結 合は一種類の Ni-Ni シェルとし、いずれのシェルお いても配位数は6に固定して計算した. Liが EXAFS 振動におよぼす影響は非常に小さいため, Liの存在 はフィッティングで考慮していない. 活物質粒子表面 のNi-O 結合距離およびNi-Me 結合距離と正極電位 との関係をそれぞれ Fig. 5 (a), (b) に示す. 正極電位 4.19 V vs. Li/Li⁺ において, 試験品の活物質粒子表面 のNi-O結合距離およびNi-Me結合距離は、初期品 のそれらとほとんど同等である.一方で,正極電位 3.74 V vs. Li/Li⁺ において, 試験品の活物質粒子表面 のNi-O結合距離およびNi-Me結合距離は、初期品 のそれらよりわずかに短い. これらのことから, 正極 電位 3.74 ~ 4.19 V vs. Li/Li⁺ において試験品の活物 質粒子表面の結合距離変化量は、初期品のそれよりも 小さいと考えられる. Ni-O 結合距離および Ni-Me 結 合距離は Ni 価数と相関があることから、試験品の活 物質粒子表面の電気化学活性が低下していること、正 極電位が卑な領域において試験品の活物質粒子表面の Ni 価数が初期品のそれよりも高いことが考えられる. すなわち,カレンダー寿命試験により活物質粒子表面



Fig. 4 Fourier-transform of Ni K-edge EXAFS spectra of surface of LiNi_{1-x}Me_xO₂ positive electrodes at (\blacksquare , —) 3.74, (\blacktriangle , —) 3.81, (\bigcirc , —) 3.95 and (\diamondsuit , —) 4.19 V vs. Li/Li⁺ at initial and after calendar life test.

の Ni 価数が高くなるような変質層が形成していることが示唆される. さらなる詳細な解析のため, Ni の 価数に直接関与する d 軌道の情報(Ni-L 吸収端),および酸素の局所構造情報(O-K 吸収端)を軟 X 線吸 収分光測定により取得した.

3.4 軟 X 線吸収分光測定の結果

各正極電位における活物質粒子表面の Ni-L 吸収端 XANES スペクトル (Ni-L₃ スペクトルのみを抜粋)を Fig. 6 に示す.全てのスペクトルにおいて 854 および 856 eV 付近にピークまたはショルダーがあり,正極電 位 4.19 V vs. Li/Li+のスペクトルを除いて初期品と試



Fig. 5 (a) Ni–O and (b) Ni–Me bond distance of surface of $LiNi_{1-x}Me_xO_2$ by Ni K–edge EXAFS analysis (\bigcirc) at initial and (\bigcirc) after calendar life test.



Fig. 6 Ni L-edge XANES spectra of surface of LiNi_{1-x}Me_xO₂ positive electrodes at $(\blacksquare, -)$ 3.74, $(\blacktriangle, -)$ 3.81, $(\bigcirc, -)$ 3.95 and $(\diamondsuit, -)$ 4.19 V vs. Li/Li⁺ at initial and after calendar life test.

験品の活物質粒子表面のスペクトルが異なっている. このことは,正極電位が卑な領域(3.74~3.95 V vs. Li/Li⁺)において初期品の活物質粒子表面に存在する Ni の電子状態と試験品のそれが異なることを示す.854 および 856 eV 付近のピーク強度をそれぞれ Ia および Ib とすると,その強度比(Ib/Ia)の増加に応じて Ni 価数 が増加することが報告されている⁶.ピーク強度比(Ib/ Ia)と正極電位との関係を Fig.7 に示す.試験品の活物 質粒子表面におけるピーク強度比は,4.19 V vs. Li/Li⁺ を除いて初期品のそれよりも大きい.このことから, 試験品の活物質粒子表面の Ni 価数変化量は初期品の それよりも小さく,かつ,正極電位が卑な領域におい



Fig. 7 Relationship between ratio of the intensity at 856 eV (I_b) to intensity at 854 eV (I_a) and potential of LiNi_{1-x}Me_xO₂ positive electrodes (\bigcirc) at initial and (\bigcirc) after calendar life test.

て試験品の活物質粒子表面の Ni 価数が初期品のそれ よりも高いと考えられる.この結果は、Ni-K 吸収端の EXAFS 領域の解析結果と良い一致を示す.以上の結果 から、カレンダー寿命試験により、活物質粒子表面に Ni 価数が高い変質層が形成しているといえる.この結 果は、Ni 系正極活物質 LiNio.80Coo.15Aloo5O2 などにお ける変質層として報告されている +2 価の Ni で電気 化学不活性な NiO の形成⁷では説明ができず、+2 価 である NiO 以外の相が存在していると考えられる. 各正極電位における O-K 吸収端 XANES スペクトル を Fig. 8 に示す.標準試料として層状岩塩構造の LiNi_{1/3}Co_{1/3}Mn_{1/3}O2 (NCM)、および立方晶岩塩構造の NiO のスペクトルも示す. 初期品の活物質粒子表面で は、いずれの電位においても NCM のピーク位置と一 致する.一方で、試験品の活物質粒子表面ではいずれ の電位においても NiO のピーク位置と一致する.た だし、立方晶スピネル構造が存在する場合、そのピー ク位置は立方晶岩塩構造の NiO と同じ位置であるこ とが報告されている⁸. そのため, NiOのピーク位置 と一致する結晶構造は立方晶岩塩構造または立方晶ス ピネル構造である.このことから,活物質粒子表面は, カレンダー寿命試験により層状岩塩構造から立方晶岩 塩構造あるいは立方晶スピネル構造に変化していると 考えられる.そして,Ni-K 吸収端および Ni-L 吸収 端の解析結果から NiO 以外の相の存在が示されてい るため、活物質表面は立方晶スピネル構造に変化して いると考えられる. ここで, バルクである層状岩塩構 造のLi_{1-a}Ni_{1-x}Me_xO₂ (Me = Co, Mn) において, Ni 価 数は+2~+4の範囲で変化する.一方で,立方晶ス ピネル構造が Li1-α (Ni1-xMex)2O4 であると仮定すると 遷移金属の平均価数は+3.5 価となり、放電状態にお いても Ni 価数は +3 価以上で存在することが可能で あると考えられる.

3.5 カレンダー寿命試験における正極活物質の劣化 モデル

硬 X 線および軟 X 線吸収分光測定の結果から,高 温カレンダー寿命試験後の正極には,次の劣化現象が 生じていることが示された.



Fig. 8 O K-edge XANES spectra of surface of LiN_{1-x}Me_xO₂ positive electrodes at (\blacksquare , —) 3.74, (▲, —) 3.81, (\bullet , —) 3.95 and (\blacklozenge , —) 4.19 V vs. Li/Li⁺ at initial and after calendar life test; Reference materials are (- - -) NiO and (· · · ·) LiNi_{1/3}CO_{1/3}Mn_{1/3}O₂ (NCM), respectively.

(i) 活物質粒子表面の電気化学活性が低下する

(ii) 活物質粒子表面に立方晶スピネル構造相が存在 する

この現象を確かめるため,初期品および試験品の Cs-STEM 分析を実施し、両者の活物質粒子表面の比 較をおこなった.まず,初期品における活物質粒子/ 電解液界面の HAADF-STEM 画像を Fig. 9 (a) に示す. 最表面(1 nm以下)にはわずかにバルクと異なる原 子配列が異なる層が見られるものの, 表面の原子配列 はバルクとほぼ同様であり,変質層はほとんど見られ ない. つぎに, 試験品の活物質粒子 / 電解液界面の HAADF-STEM 画像と表面のナノビーム回折パターン を Fig. 9 (b) に示す. 活物質粒子 / 電解液界面には 3 nm 程度のバルクと異なる原子配列(変質層)が存在 しており、この変質層はナノビーム回折パターンから 立方晶スピネル構造 (Fd-3m) であることを確認した. この結果は、X 線吸収分光測定から得られた結果を支 持するものである. 試験品における別箇所の活物質粒 子 / 電解液界面の HAADF-STEM 画像と表面のナノビ ーム回折パターンを Fig. 9 (c) に示す. 活物質粒子 / 電解液界面には 4 nm 程度のバルクと異なる変質層が



Fig. 9 Cross-sectional HAADF-STEM images of LiNi_{1-x}Me_xO₂ at 4.19 V vs. Li/Li⁺; (a) active material (AM)/electrolyte interface at initial, (b) AM/electrolyte interface after calendar life test, (c) AM/electrolyte interface of another particle after calendar life test, and (d) AM/AM interface after calendar life test. Insets in (b) and (c) are nano-diffraction patterns in red circle, respectively.

存在しており、この変質層はナノビーム回折パターン から立方晶岩塩構造 (Fm-3m) であることを確認した. このような立方晶岩塩構造が、変質層として部分的に 存在していることも確認している. すなわち, 変質層 には, 主に立方晶スピネル構造とわずかに立方晶岩塩 構造が存在していると考えられる.一方で,試験品の 活物質粒子 / 活物質粒子界面の HAADF-STEM 画像を Fig. 9 (d) に示す. この界面には変質層は見られてい ない. このことから,変質層は電解液と接触している 活物質粒子表面で形成・成長するものと考えられる. 以上の結果をふまえ, 高温カレンダー寿命試験により 正極の反応抵抗の増加を引き起こした劣化モデルを Fig. 10 に示す. 一次粒子である活物質粒子は互いに 凝集して二次粒子を構成しており,活物質粒子表面に は電解液と接触している部分と別の粒子と接触してい る部分とが存在する. 電池の作製後, 高温カレンダー 寿命試験中に電解液と接触している活物質粒子表面に 立方晶スピネル構造を主とする変質層が形成される. その結果、その部分の活物質粒子表面の電気化学活性 が低下するという劣化現象が生じる. これまでに, 層 状岩塩構造のLiCoO2の表面に立方晶岩塩構造のCoO が存在する界面モデルを作成して層状岩塩構造内部お よび界面近傍のLi+の活性化エネルギーを計算したと ころ, 界面近傍の活性化エネルギーが増大することが 報告されている⁹.本報告における LiNi_{1-x}Me_xO₂ (Me = Co, Mn) は LiCoO₂ と同様に層状岩塩構造であり, 界面に CoO と同様の立方晶岩塩構造に加えて、立方 晶スピネル構造も含む.界面の立方晶スピネル構造は、 立方晶岩塩構造と同様にLi⁺の活性化エネルギーを増 大させて正極の反応抵抗の増大を引き起こすものと推 察される.なお、変質層における立方晶スピネル構造 と立方晶岩塩構造の割合は、活物質組成だけでなく、 カレンダー寿命試験の温度や SOC 条件などにも依存 すると考えられる、今後は、それぞれの構造について、



Fig. 10 Schematic representation of the mechanism of resistance increment for positive active material through calendar life test at high temperature.

形成時の反応式や反応抵抗の増加におよぼす影響の解 明を通じ,正極の劣化モデルの構築と,効果的な劣化 抑制手法の提案につなげたいと考えている.

4 おわりに

本報告では,硬X線ならびに軟X線吸収分光法を 利用して,高温カレンダー寿命試験前後の電池の正極 活物質粒子の局所構造を解析した.その結果,試験後 に活物質粒子表面の電気化学活性が低下しているこ と,および主に立方晶スピネル構造の変質層が活物質 粒子表面に形成されていることを明らかにした.この 変質層の形成が正極の反応抵抗の増加を引き起こし, 試験後の正極全体の抵抗増加の主要因となったと推察 される.今後は,本研究で得られた知見をもとに,正 極の劣化モデルの構築と,効果的な劣化抑制手法の提 案につなげたいと考えている.

文 献

- 田尾洋平, 増田真規, 山福太郎, 森澄男, 佐々木丈, 稲益德雄, 吉田浩明, *GS Yuasa Technical Report*, **11**, 17 (2014).
- D. P. Abraham, R. D. Twesten, M. Balasubramanian, J. Kropf, D. Fischer, J. McBreen, I. Petrov, and K. Amine, *J. Electrochem. Soc.*, **150**, A1450 (2003).
- H. Yoshida, N. Imamura, T. Inoue, and K. Komada, *Electrochemistry*, **71**, 1018 (2003).
- T. Nonaka, C. Okuda, Y. Seno, H. Nakano, K. Koumoto, and Y. Ukyo, *J. Power Sources*, **162**, 1329 (2006).
- 5. http://cars9.uchicago.edu/ifeffit/Ifeffit
- H. Kobayashi, Y. Takenaka, Y. Arachi, H. Nitani, T. Okumura, M. Shikano, H. Kageyama, and K. Tatsumi, *Solid State Ionics*, **225**, 580 (2012).
- S. Muto, Y. Sasano, K. Tatsumi, T. Sasaki, K. Horibuchi, Y. Takeuchi and Y. Ukyo, *J. Electrochem, Soc.*, **156**, A371 (2009).
- 8. M. Shikano, H. Kobayashi, S. Koike, H. Sakaebe, Y. Saito, H. Hori, H. Kageyama, and K. Tatsumi, *J. Power Sources*, **196**, 6881 (2011).
- 9. 世木隆, HPCIシステム利用研究課題 利用報告書, hp140095 (2014).